非晶質からの X 線散乱

月村勝宏1)

1. はじめに

原子配列が3次元方向に周期性のある物質が結 晶であり,原子配列に周期性がない固体物質が非晶 質です.結晶には,石英,長石,雲母などの造岩鉱 物,食塩,金属があります.液晶や粘土鉱物のスメ クタイトのように2次元方向だけに周期性をもっ た物質を2次元結晶と呼ぶこともあります.非晶 質には,ガラス,紙,木,プラスチックなどがあり ます.最近では非晶質金属や非晶質半導体が新材料 として注目されています.地球科学の研究対象であ る海底堆積物や土壌にも非晶質がたくさん存在しま す.

地表での化学反応において非晶質は重要や役割を 果たしています.地表のように温度が低いところで は、シリケート結晶は溶解や沈殿が遅いのですが. シリケートでも地表にできた非晶質は微細であるた め表面積が大きく、溶解や沈殿も速くなります.ま た、表面積が大きいので吸着能も高くなります.重 金属や有機物もこの表面に吸着されます.酸性雨も 非晶質により中和されます(田口ほか,1993).

天然の非晶質は、地球科学や地球環境にとって重 要な物質であるにもかかわらず、分析が困難である ために、あまり研究されていません。粒子が微細で あるために分離して分析することもできないし、 X線散乱でピークがでないために同定や定量が困 難です。しかし、精密に測定し、注意深く解析すれ ば、非晶質の同定や定量ができます。ここでは、結 晶と対比させながら非晶質のX線散乱を説明し、 X線散乱法で天然物質の非晶質の含有量を推定し ます。

2. 原子配列とX線散乱パターン

物質にX線を当てると,その物質から新たにX 線が出ます(第1図).これをX線散乱と言い,角 度による強度分布をX線散乱パターンと言います. このパターンはX線粉末回折装置で測定できます. X線散乱パターンは物質の原子配列で決まるので, 結晶と非晶質ではパターンが大きく異なります.こ こでは,結晶と非晶質の散乱パターンの違いを説明 します.

第2図は気体(ランダムに並んだ原子の集合)の X線散乱パターンです.それぞれの原子からX線 が散乱しますが,気体では原子の位置がランダムで あるために,どの角度でもそれぞれの原子からの散 乱X線の位相がランダムになり,特定の角度で強 度が強くなりません.第2図にあるように,低角 から高角に行くにしたがい滑らかに減衰します.こ の減衰は原子の電子分布状態を表します.電子が一 点に集まっていれば,減衰せず一定の値をとります が,原子の電子分布に広がりがあるとX線散乱パ ターンは高角に行くに従い減衰します.



キーワード:非晶質,ガラス,X線,X線散乱,X線回折,土
壊,関東ローム,海底堆積物,非晶質定量,鉱物
定量

1) 地質調査所 鉱物資源部

1995年12月号



第2図 気体(ランダムな原子配列をもつ物質)のX線散乱パターン.



第3図 非晶質のX散乱パターン.



第4図 結晶のX線散乱パターン.

第3図が非晶質のX線散乱パターンです.この 図は簡単に2次元で表してありますが、実際の非 晶質は3次元です.非晶質では結晶と同様に原子 が結合しており、結合の種類が同じであればその距 離はほぼ一定になります.この例では結合距離が 5Å(オングストローム)であるため、原子間の距離 が5Åである組み合わせがたくさんあります.一 方、原子間距離が5Å以下のものがなく、5Åより 少し長いものがあります.原子配列に少し規則性が あります.この規則性を反映して、X線散乱パタ ーンは波を打ちます.原子の結合距離からどこに極 大値と極小値があるかおおよその検討をつけること ができます.非晶質からのX線散乱は、古くから 研究されており、非晶質中の原子間距離などを求め た研究が数多くあります.非晶質からのX線散乱 の理論については、James(1963)や片田欽也、柿木 二郎(1960)を参照ください.

第4図が結晶のX線散乱パターンです.この図 も簡単に2次元で表してありますが,実際の結晶 は3次元です.原子は規則正しく並んでおり,周 期性があります.周期性があるので,特定の角度で すべての原子からの位相が一致して,強いX線を 散乱します.この現象を回折と呼びます.回折X 線の位置から鉱物の同定ができます.また,それぞ れの強度を精密に測定することにより,結晶構造も 決められます.

3. 非晶質の X 線散乱パターン

自然界にもっともよくある非晶質として、シリカ ガラス(SiO₂)、アルミノシリケートゲル(Al/Si比 =4)、非晶質水酸化鉄(FeOOH)のX線散乱バター ンを第5図に示しました.なお、X線源は管球か らのCuK α 線(40 kV, 40 mA)を、分光結晶は散乱 X線側にグラファイトを使いました.ステップ角 度が0.04°、計数時間が各4秒です.ダイバージェ ンス・スリットは1/2°、レシービングスリットは 0.4 mm です.

非晶質のX線散乱パターンは、種類により異な りますが、どれもが波を打つ滑らかな曲線です.結 晶からの回折に比べると、バックグラウンドのよう なものです.極大値は、シリカガラスが22°付近に、 アルミノシリケートゲルが27°付近に、非晶質水酸 化鉄が36°付近にあります.また、それぞれの山の 半値幅は、シリカガラスが12°、アルミノシリケー トゲルが22°、非晶質水酸化鉄が10°です.このよう に種類によりX線散乱パターンが異なるので、こ れを利用して非晶質の種類を決めることができま す.

ただし,絶対的な強度については,単純な比較は できません.極大値の強度は,シリカガラス,アル ミノシリケートゲル,非晶質水酸化鉄の順ですが, 水酸化鉄の散乱強度が低いのは,X線吸収係数が 大きいためです.使用した CuK α線は鉄の吸収係 数が大きいのでX線の試料への侵入が浅く,X線 を散乱させる物質が少なくなるために散乱強度が弱 くなります.また,シリカガラスとアルミノシリケ ートゲルの吸収係数はほぼ等しくなります.もし, 吸収の効果がないとすれば,シリカガラスと非晶質



第5図 非晶質からのX線散乱の例.(a)シリカガラス, (b)アルミノシリケートゲル(Al/Siモル比=4.0), (c)非晶質水酸化鉄.

水酸化鉄の強度はほぼ同じくらいになり,極大値の 強度はシリカガラス,非晶質水酸化鉄,アルミノシ リケートゲルの順になります.なお,ひとつの試料 では,X線の侵入する深さが同じなので,各反射 の強度比は吸収係数に無関係になります.

4. 混合試料の X 線散乱パターン

結晶と非晶質の混合試料を人工的に作成し,その X線散乱パターンを測定しました.かなりの量の 非晶質が含まれていたとしても,非晶質の存在に気 づきにくいことを説明します.この測定結果は,5. で行う定量のためのデータにもなります.

石英と非晶質であるアルミノシリケートゲル (Al/Si モル比=4.0)をそれぞれ(a)10:90,(b)50: 50,(c)100:0の重量比で混合した試料を作製し, 同一条件で測定した強度パターンを第6図の(a), (b),(c)に示します.(a)には石英からのピークが 4本あります.石英の最強線のピーク強度は2,300 カウントと少し弱く,バックグラウンドは400カウ ントと少し高いですが,普通は石英を記載しても非

-21 -

1995年12月号



 2θ / degree

第6図 結晶と非晶質の混合試料からのX線散乱パターン. (a)石英結晶10%とアルミノシリケートゲル 90%. (b)石英結晶50%とアルミノシリケートゲル50%. (c)石英結晶100%.

晶質を記載しないでしょう.しかし,この試料に は、非晶質が90%も含まれており、石英は10%し か含まれていません.(b)では、石英の最強線のピ ーク強度は9,800カウントもあり、バックグラウン ドは220カウントと弱くなるため非晶質は含まれな いように見えます.しかし、これでも非晶質を 50%も含んでいます.(c)は石英の最強ピーク値が 20,000カウントもあり、バックグラウンドが50カ ウントと低くなっています.このパターンでようや く結晶だけと言えます.なお、このバックグラウン ドは、主に、空気からの散乱と粉砕中に石英からで きた非晶質シリカからの散乱です.

同一試料中での強度比をとると吸収の効果がなく なるので(Alexander & Klug, 1948),結晶からの X線散乱のピーク値と,非晶質によるバックグラ ンド値の比から,非晶質の量を決めることができま す.第6図の石英結晶とアルミノシリケートゲル の2成分系について,定量法を説明します.第6 図(b)では、石英と非晶質が同量含まれています が、石英の最強線ピーク値9,800カウントに対して、 2 $\theta(シ- g) = 25$ °におけるバックグラウンド値は 220カウントです. ピークとバックグラウンドの比 は45です. したがって、アルミノシリケートのバ ックグラウンド値を45倍すれば石英との量比をカ ウント数で直接比較できます. この方法で第6図 (a)の強度比から石英と非晶質の定量を行ってみま す. 第6図(a)では、バックグラウンド値の400カ ウントを45倍すると18,000カウントになります. この18,000カウントを石英の最強線のピーク値 2,300カウントで割ると7.8となり、非晶質は石英結 晶の7.8倍あると計算できます. これから非晶質の 量を計算すると89%となり、実際の割合90%とほ ぼ一致します.

他の結晶や非晶質でも、以上のような方法でおお よその量比を推定することはできます.最初に、バ ックグラウンドの形から非晶質の種類を決め、その バックグラウンド値に、その非晶質に応じた倍率を かければ、石英との量比を直接決めることができま す.また、石英以外の結晶と石英の量比を求めるた めには、その結晶の最強ピーク値にかけるべき倍率 を求めておく必要があります.例えば、長石の最強 線にかけるべき倍率を求めるには、石英と長石を同 量混ぜた試料のX線散乱パターンを測定し、それ ぞれの最強ピーク値を測定すれば、長石にかけるべ き倍率が求まります.この方法で倍率を求めると、 長石で約1倍、雲母で約5倍、カオリナイトで約 5倍、ギブサイトで約0.17倍となります.

5. 天然試料の非晶質の定量

ここでは、天然試料のX線散乱パターンを測定 し、そこに含まれている非晶質のおおよその量を、 4.で求めたデータを利用して推定します.試料は、 関東ローム(東京都世田谷区),地質調査所の表土 (茨城県つくば市)、海嶺付近の海底堆積物(地質調 査所丸茂克美博士提供)の3種類です.第7図が以 上3種類のX線散乱パターンです.

関東ロームは、石英とギブサイト Al(OH)₃ があ りますが、これらの結晶からのピーク強度は弱くバ ックグラウンドが高いので、この試料はかなりの量 の非晶質を含んでいそうです. バックグラウンドの

地質ニュース 496号



第7図 非晶質を含む天然試料のX線散乱パターン.(a) 関東ローム(東京都世田谷区).(b)地質調査所の 表土(茨城県つくば市).(c)海嶺付近の海底堆積 物(地質調査所丸茂克美博士提供).

形は、アルミノシリケートゲルに近いので、含まれ ている非晶質はアルミノシリケートゲルだと仮定し ます.25°のバックグラウンド値は約300カウント (石英換算13,500カウント)です.ギブサイトの最強 線ピーク値が800カウント(石英換算140カウント), 石英の最強線ピーク値が1,600カウントなので、重 量比は非晶質89%、ギブサイト1%,石英10%に なります.

地質調査所の表土は、結晶として石英と長石と雲 母を含みますが、これらのピーク強度は弱く、バッ クグラウンドが高いので、この試料もかなりの非晶 質を含んでいそうです。バックグラウンドの形はア ルミノシリケートゲルに似ているので、含まれてい る非晶質はアルミノシリケートゲルだと仮定します。 25°のバックグラウンド値は400カウント(石英換算 18,000カウント)になります。結晶の最強線ピーク 値は、石英が3,400カウント,長石が1,200カウント (石英換算1,200カウント)、雲母が400カウント(石 英換算2,000カウント)になります。したがって、重 量比は、非晶質が73%、石英が14%、長石が5%、 雲母が2%となります。

海底堆積物は、クローライトやイライトなどの粘 土鉱物と石英や長石の結晶を含んでいます.粘土鉱 物や結晶のピークは低く、バックグラウンドが高い

ので、この試料もかなりの非晶質を含んでいそうで す. バックグラウンドの形はアルミノシリケートゲ ルに似ています.しかし, 海底堆積物の場合, 粘土 鉱物をかなり含んでおり、粘土鉱物の積層不整によ る散漫散乱でバックグラウンドが高くなっているの で、これまでの方法をそのまま使えません。また、 小さなピークがたくさんあるので, バックグラウン ドを決めることも困難です.しかし,2θ=14-17° ではそれらの影響をあまり受けないので、ここのバ ックグラウンドの値から非晶質の量をおおまかに見 積もることはできます. 15°付近のバックグラウン ド値は、関東ロームや地質調査所の表土の約半分で す. 吸収係数がほぼ同じだとすれば、関東ロームや 地質調査所の表土の約半分の非晶質が含むことにな ります. 海底堆積物の方が鉄を多く含むので, 吸収 係数は大きくなり、バックグラウンド値は下がりま す.したがって,吸収補正をすれば非晶質の量は多 くなります.以上から,海底堆積物は30%以上の 非晶質を含んでいそうです.

6. 定量法の問題点と今後の指針

非晶質の定量法には,

1) 非晶質からの散乱強度だけを使う

2)結晶からの散乱強度だけを使う

3) 非晶質と結晶の両方の散乱強度を使う

4)X線散乱パターン全体を使う

の4種類の方法があります.これらの方法の長所 ・短所を議論し,今後の定量法に関する指針を述 べます.

非晶質からの散乱強度を使う方法には検量線を使 う方法と内部標準を使う方法が報告されています. 検量線による方法には,非晶質(生物起源のシリカ や火山灰)と石英の混合物を測定した例があります (Lapaquellerie, 1987).非晶質と石英の割合を変え た混合試料についてX線散乱強度を測定し検量線 をつくり,非晶質の定量ができることを主張してい ますが,実際の天然試料の測定は行っていません. この検量線による方法は,含まれている結晶鉱物が 1 種類ならば簡単ですが,鉱物の種類が多くなると 検量線を作る作業が多くなるので,複数の鉱物が混 じっている天然試料には向きません.また,内部標 準を使った例には,海底堆積物中のアロフェン・ア

第1表 海底堆積物中の非晶質の重量%

試料番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
化学的抽出法	48	49	50	31	50	46	37	46	44	16
X線散乱法	21	25	33	35	44	27	30	41	33	31

ルミナゲル・非晶質水酸化鉄の定量があります (Cruuz and Real, 1991).内部標準を使う方法は, 吸収計数の影響がないので複数の鉱物を含む天然試 料の測定に向いています.私が知る限りでは,この 研究が天然物質中の非晶質量をX線散乱により測 定した唯一の例です.しかし,この報告には,非晶 質からの散乱を分離する方法に疑問がありますが, これについての記述がありません.海底堆積物中の 非晶質の量を21-44%と求めていますが,化学的な 抽出法により求めた非晶質量との一致はあまりよく ありません(第1表).

関東ロームや地質調査所の表土のように粘土鉱物 からの散漫散乱があまりない試料については,非晶 質からの散乱強度から非晶質の量を求める方法は有 望です.特に,非晶質の少ない試料については,結 晶の定量を行い残りを非晶質とする方法よりも精度 がでます.しかし,バックグラウンドの強度から非 晶質の定量をする方法は,非晶質だけからの散乱を 抽出することが難しい場合があるとの難点がありま す.特に,海底堆積物のように粘土鉱物がたくさん 含まれている試料では,粘土鉱物からの散漫散乱が あり,定量は難しくなります.そこで,粘土鉱物か らの散漫散乱の影響をあまり受けない2 θ =15-17° 散乱強度から非晶質の量を推定する方法が提案され ています(月村,1994).今回,海底堆積物中の非 晶質量を推定したのと原理的には同じ方法です.

結晶からの散乱を使う方法は,内部標準を使って 結晶の定量を行い(Alexander and Klug, 1948),残 りを非晶質とするものです(Chung, F. H., 1974; Popovcvic, B. and Grezeta-Plenkovic, B., 1979). この方法は,非晶質からだけのバックグラウンドを 抽出するとの困難な作業がない点ですぐれていま す.特に,粘土鉱物がたくさん含まれている試料に 有効です.この方法は,非晶質の量が多い場合には精度 がわるくなりますが,非晶質が少ない場合には精度 がわるくなります.今,結晶の定量精度が1/10だ としましょう.結晶が10%含まれているときには, 結晶の量は10±1%と決められるので,非晶質の量 は90±1%と決められます.しかし,結晶が90%も 含まれているときには,結晶の量は90±10%と決 まり,非晶質の量は10±10%となって,定量でき ません.この方法が天然物質に応用された例はまだ ないようですが,非晶質の種類を決めずに定量でき るので,非晶質の定量法として有望です.

結晶からの散乱と非晶質からの散乱の両方を使う 方法には, 内部標準を使わない方法と内部標準を使 う方法が考えられます. 今回用いた方法は内部標準 を使わない方法です.結晶の最強線のピーク値と非 晶質のバックグラウンド値から,含まれている物質 (結晶と非晶質)の量比(石英の量を1としたとき相 対比)を決め,全体が100%になるようにして重量 比を求めました. これは,結晶の定量法として提案 されている方法(Chung, 1974)を, 非晶質が含まれ ている試料に応用したものです.非晶質からの散乱 強度と結晶からの散乱強度の両者を使いますが,内 部標準を使わないので測定は簡単です.なお、今回 は結晶からのピーク値を使いましたが、積分強度を 使う方が正確な測定ができます. この方法に内部標 準を使うことも考えられます. 内部標準を使えば, 含まれている結晶と非晶質の絶対量が求められるの で、全体が100%になるかのチェックができます. また、結晶と非晶質の両方の定量を独立に行うの で、非晶質の量が多くても少なくても、精度が良く なります.ただし、粘土鉱物を多く含む試料につい ては、非晶質からの散乱だけを抽出することが難し いとの難点はあります. その場合は結晶の定量だけ を行い,残りを非晶質とする方法にもどれます. こ の方法が簡単で有効な方法です. 今後, 様々な鉱物 や非晶質の定量ができるようにデータを蓄積し、こ の方法で天然物質の定量を行えるようにしたいと考 えています.

さらに進んだ方法としては、X線散乱パターン 全体を使う方法があります.結晶や非晶質の構造か らX線散乱パターンを計算し、測定したX線回折 パターンにカーブフィッティングして、非晶質の割 合を計算するものです(Ruland, 1961; Vonk, 1973). この方法による応用解析ソフトが「結晶化 度の計算」としてX線回折装置に付属してること もあります.このソフトには、空気からの散乱や非 弾性散乱を差し引く補正や、熱振動による結晶から のピークの減衰の補正が組み込まれており、完成度 の高いものです.しかし,これが使えるのは,石英 結晶と石英ガラスのように結晶と非晶質が同じ組成 のものだけを含む試料です.純粋な系における非晶 質の結晶化実験などには使えますが,様々な物質を 含む天然物質の定量には向きません.そこで,これ をさらに発展させて,様々な鉱物や非晶質の構造か らX線散乱パターンを計算して,測定データにカ ーブフィッティングさせる方法が考えられます.そ のためのソフトを作る必要がありますが,粘土鉱物 の積層不整の変数を組み込むことなどやっかいな問 題もあるので,この開発に取り組んだとしても実用 になるまでには時間がかかりそうです.

7. おわりに

ここでは、非晶質からのX線散乱を説明し、実際に天然試料のX線散乱を測定して、関東ローム・地質調査所の表土・海底堆積物には、非晶質が何十%もあることを求めました.また、これまでの研究をレビューし、非晶質のX線散乱による定量法について検討しました.結晶の定量に比べて非晶質の定量は難しいですが、X線散乱による非晶質の定量ができることを示しました.非晶質は地表に多量にあるばかりでなく、地表の化学反応を考える上で、もっとも重要な固体物質です.しかし、地表の非晶質については、わからないことがたくさんあります.今後、多くの人と協力して研究を進め、この分野を進展させたいと思います.

献

Alexander, L., Klug, H. (1948): Basic aspects of X-ray absorption. Analyt. Chem., 20, 886-889.

文

- James, R. W. (1962): The optical principles of the diffraction of X-rays. G. Bell and sons LTD, London.
- Chung, F. H. (1974): Quantitaive interpretation of X-ray diffraction patterns of mixtures. I. Matrixflushing method for quantitative multicomponent analysis. J. Appl. Cryst., 7, 519–525.
- Chung, F. H. (1974): Quantitaive interpretation of X-ray diffraction patterns of mixtures. II. Adiabatic principle of X-ray diffraction analysis of mixtures. J. Appl. Cryst., 7, 526-531.
- 片田欽也,柿木二郎(1960):気体,液体,非晶質固体による回折. X線結晶学 下巻(編集 仁田勇),421-515.
- Lapaquellerie, Y. (1987): Utilization de la diffractometrie X pour la determination des constituants amorphes dans les sediments marins (silice biogene et cendres volcaniques), Clay Minerals, 22, 457-463.
- Cruz, M. D. R., Real, L. M. (1991): Practical dertemination of allophane and synthetic alumina and iron oxide gels by X-ray diffraction, Clay Minerals, 26, 377-387.
- Ruland, W. (1961) X-ray determination of crystallinity and diffuse diorder scattering, Acta Cryst. 14, 1180–1185.
- 田口雄作・安原正也・丸井教尚・月村勝宏・柳沢幸夫・塚田公彦 (1992):酸性降下物の陸水・土壌への影響機構に関する研究 (2)地質・土壌の酸性雨に対する水文地質学的応答特性に関す る研究.環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課研究調 査室編「平成4年度地球環境研究総合推進費研究成果報告集 (III)」,45-52.
- 月村勝宏(1994):X線散乱による非晶質の定量法. 1995年度日本 鉱物学会要旨集, 156.
- Vonk, C. G. (1973): Computerization of Ruland's X-ray method for determination of the crystallinity in polymers. J. Appl. Cryst., 6, 148-152.

TSUKIMURA Katsuhiro (1995): X-ray scattering from amorphous materials

〈受付:1994年12月26日〉